

PSA-18 ポスター講演一覧

P-01	電界イオン顕微鏡を用いた触媒表面反応の観察 ○鈴木匠、陈 孙维、尾張真則 東京大学 生産技術研究所
P-02	The interaction of O ₂ and residual H on Pt surface: studies by field ion microscopy and in-situ surface atom probe チエンソンイ 東京大学 生産技術研究所
P-03	三次元shave-offSIMSの実現に向けた二次イオン光学系の開発 ○松村康平、カン・ソヒ、富安文武乃進、尾張真則 東京大学 生産技術研究所
P-04	Angular distribution of sputtered particles in shave-off section processing 姜少熙 東京大学 生産技術研究所
P-05	広立体角観察を可能にするTOF-SIMS用試料ホルダーの開発と実用化 ○飯田真一、宮山卓也、田中伊吹 アルバック・ファイ株式会社
P-06	生体組織TOF-SIMSデータの多変量解析による分類 我妻佑一、石倉航、山?崇之、○青柳里果 成蹊大学 物質計測・イメージング研究室
P-07	ペプチドと脂質試料TOF-SIMSデータのLASSOによる解析 溝道桂介、石倉航、山?崇之、志賀基紀、○青柳里果 成蹊大学理工学部、岐阜大学
P-08	定量のための実スペクトルにおける背面散乱電子量の補正の検討 堤建一 日本電子
P-09	銅酸化物に対するオージェパラメーターを用いた化学状態分析 ○島政英、堤建一、田中章泰、小野寺浩、種村真幸 日本電子(株)、名古屋工業大学
P-10	XPSデータベースWG活動報告 ○藺林豊、高野みどり、吉川英樹 国立大学法人京都大学、パナソニック株式会社AIS社、国立研究開発法人物質・材料研究機構
P-11	XPSスペクトル解析における情報量基準を用いたモデル選択 ○篠塚寛志、吉川英樹、村上諒、仲村和貴、田中博美、吉原一紘 物質・材料研究機構、米子工業高等専門学校、シエンタオミクロン株式会社
P-12	参照スペクトル照合型動的Shirley法によるXPSスペクトル解析 ○仲村和貴、村上諒、田中博美、篠塚寛志、吉川英樹、吉原一紘 米子高専、物質・材料研究機構、シエンタオミクロン
P-13	XPSスペクトル解析のハイスループット化を目指したActiveShirley法の改良 ○村上諒、仲村和貴、田中博美、篠塚寛志、吉川英樹、吉原一紘 米子高専、物質・材料研究機構、シエンタオミクロン株式会社
P-14	実験室硬X線光電子分光装置によるAl添加ZnO薄膜のドーパント化学状態評価 ○武田樹、牧野久雄 高知工科大学、システム工学群
P-15	AichiSRテンドー-X線XAFS・XPSビームラインBL6N1の現状報告：二結晶分光器更新によるビームライン性能の向上 ○陰地宏、村井崇章、柴田佳孝、田淵雅夫、渡辺義夫、竹田美和 名古屋大学シンクロトロン光研究センター、科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター、 あいち産業科学技術総合センター
P-16	蛍光収量、全電子収量同時検出硬X線XAFS測定による動作中全固体電池深さ方向の充放電反応分布解析 ○中西康次(*), 森田善幸(**)、田中寛久(**)、木内久雄(**) *立命館大学、**京都大学
P-17	ED-XRFの一次フィルタを用いた軽合金材料の微量分析 ○宇津木里香、衣笠元氣、永岡浩充、高橋はるな、堤建一、小野寺浩 日本電子(株)